

УДК 548.0:537.226

О. Г. ВЛОХ, Л. А. ЛАЗЬКО и В. Я. НЕСТЕРЕНКО

ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОГИРАЦИОННОГО ЭФФЕКТА
В КРИСТАЛЛАХ α -НІО₃

Электрогириационный эффект, предсказанный Желудевым [1], был надежно обнаружен и исследован лишь в кристаллах кварца [2]. Нам удалось наблюдать этот эффект также в гиротропных кристаллах иодноватой кислоты α -НІО₃, принадлежащих к ромбодилическому классу симметрии 222.

Исходя из разложения гирации в ряд по степеням внешнего электрического поля $G = (g_{ij} + \gamma_{ki}E_k + \dots)l_il_j$ и формы тензоров естественной гирации g_{ij} [3], а также линейной электрогоириации γ_{ki} [1] для класса 222; гирацию кристаллов α -НІО₃ в линейном приближении можно описать соотношением

$$G = g_{11}l_1^2 + g_{22}l_2^2 + g_{33}l_3^2 + 2\gamma_{14}E_1l_2l_3 + 2\gamma_{25}E_2l_3l_1 + 2\gamma_{36}E_3l_1l_2, \quad (1)$$

где l_i , l_j — направляющие косинусы волновой нормали, E_k — компоненты напряженности электрического поля.

Таким образом, наблюдение эффекта вдоль оптической оси, лежащей в плоскости XZ , возможно при действии поля в направлении оси y . В этом случае в сферической системе координат уравнение (1) примет вид

$$G = g_{11}\sin^2\theta + g_{33}\cos^2\theta + \gamma_{25}E_2\sin 2\theta,$$

где θ — угол между оптической осью и тупой биссектрисой (осью z), равный 67° для $\lambda = 632,8 \text{ нм}$. Тогда изменение гирации вдоль оптической оси $\Delta G = \gamma_{25}E_2\sin 2\theta$, а со-

ответствующее изменение удельного вращения плоскости поляризации

$$\Delta\rho = \frac{\Delta\Phi}{d_0} = \frac{\pi}{\lambda n_y} \Delta G = \frac{\pi}{\lambda n_y} v_{25} E_2 \sin 2\theta, \quad (2)$$

где n_y — главный показатель преломления волны, распространяющейся вдоль оптической оси, d_0 — толщина кристалла по оптической оси, $\Delta\Phi$ — прирост фазы, обусловленный электротогирадией, т. е. изменением угла поворота плоскости поляризации.

С использованием гелий-неонового лазера исследовались образцы α -НIO₃ размежами 1,341 и 2,819 см соответственно вдоль оси y и оптической оси. По существу эксперимент состоял в измерении угла поворота анализатора в положение компенсации просветления, возникающего под действием внешнего статического поля, по центру интерференционной коноскопической картины, характерной для двуосных кристаллов, вырезанных перпендикулярно оптической оси. Угловые размеры диафрагмы выбирались оптимальными ($\sim 0,8'$) и значительно меньшими шириной центрального интерференционного минимума. Так как электротогирадиация сопровождалась электрооптическим эффектом, вызывающим смещение интерференционной картины (рис. 1), то отверстие диафрагмы фотоэлектронного умножителя при помощи микровинтовых механизмов устанавливалось строго по центру картины до и во время наложения поля. Контроль положения диафрагмы осуществлялся визуально по коноскопической картины и по уровню сигнала фотоумножителя.

Результаты исследования, представленные на рис. 2, указывают на линейную зависимость изменения удельного вращения плоскости поляризации $\Delta\rho$ от напряженности электрического поля E_y . На основе данных рис. 2 и показателя преломления n_y [4] по формуле (2) находим, что при комнатной температуре для $\lambda = 632,8$ нм величина $v_{25} = 1,30 \pm 0,21 \cdot 10^{-8}$ ед. CGSE.

Поскольку наблюдаемый эффект достаточно мал, то весьма важно проанализировать влияние на него сопутствующих явлений, в частности, пьезоэлектрической деформации кристалла и электрооптического эффекта. Предполагая, что при пьезоэлектрической деформации величина удельного вращения остается постоянной, а поворот плоскости поляризации изменяется вследствие изменения толщины образца вдоль оптической оси, обусловленного деформацией сдвига в плоскости XZ , получим

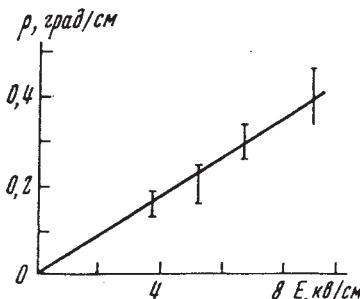


Рис. 2. Зависимость изменения удельного вращения плоскости поляризации кристаллов α -НIO₃ от напряженности электрического поля E_y

$$\Delta\Phi = \rho d_0 = \rho d_{25} \operatorname{ctg}\theta (\cos^2\theta - \sin^2\theta) E_y,$$

где d_{25} — пьезоэлектрический коэффициент [5]. Найденная таким способом величина $\Delta\Phi$ при $E_y = 7,46$ кв·см⁻¹ составляет $10''$, т. е. 0,9% от наблюданной экспериментально.

Вследствие смещения оптической оси от нормали к пластинке, вызванного электрооптическим эффектом, также изменяется оптический путь в кристалле. Это смещение может быть обусловлено либо изменением угла между оптическими осями, либо поворотом оптической индикаторы. Легко показать, что в первом случае угол между оптической осью и осью z изменяется на величину

$$\Delta\theta \approx \frac{1}{2} \frac{(r_{25}E_y)^2}{(a^2 - c^2)^2} \sqrt{\frac{a^2 - c^2}{b^2 - c^2}},$$

а во втором — угол поворота оптической индикаторы в плоскости XZ с достаточной точностью определяется соотношением

$$\xi_2 = r_{25}E_y / (a^2 - c^2), \quad (3)$$

где r_{25} — электрооптический коэффициент, a , b и c — обратные величины главных показателей преломления n_x , n_y и n_z соответственно. Как видно из представленных соотношений $\Delta\theta \ll \xi_2$, поэтому достаточно принимать во внимание лишь второй фактор.

Угол поворота оптической индикаторы ξ_2 рассчитывался по величине экспериментально наблюдаемого смещения коноскопической картины (рис. 1). Величина сме-

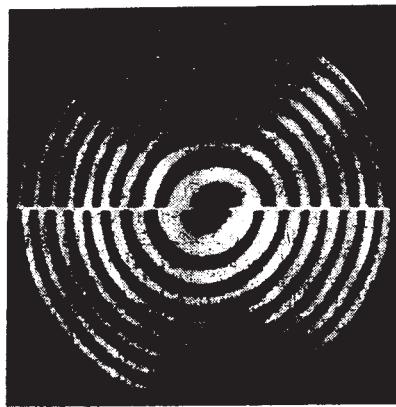


Рис. 1. Смещение интерференционной коноскопической картины при поле $E_y = 7,46$ кв·см⁻¹

щения измерялась на микроскопе МИР-12 по негативу фотографии, полученной при использовании диафрагмы, поочередно закрывающей верхнюю (без поля) и нижнюю (с полем) части картины. В расчетах учитывался показатель преломления n_y и расстояние картины от кристалла (547 см). При $E_y = 7,46 \text{ кв. см}^{-1}$ угол $\xi_2 = 28 \pm 1''$. Существенно отметить, что эти данные можно использовать для определения электрооптического коэффициента r_{52} . Учитывая (3), для $\lambda = 632,8 \text{ нм}$ находим $r_{52} = 2,14 \pm 0,15 \cdot 10^{-7} \text{ ед. CGSE}$. На этом результате в отличие от данных, полученных по измерениям изменений двулучепреломления [6], не оказывается влияние оптической активности кристаллов. Он хорошо согласуется с данными [4,7]. Нетрудно убедиться, что при столь малых отклонениях оптической оси от нормали к пластинке изменение оптического пути и связанное с ним изменение вращения плоскости поляризации значительно меньше точности эксперимента.

Следовательно, с полным основанием можно констатировать, что электрическое поле непосредственно влияет на оптическую активность кристаллов $\alpha\text{-NIO}_3$, вызывая эффект линейной электрогирации.

Литература

1. И. С. Желудев. Кристаллография, 9, 4, 501, 1964.
2. О. Г. Влох. Ж. эксперим. и теор. физ. Письма в редакцию, 13, 3, 118, 1971; Укр. физ. ж., 15, 5, 769, 1970; там же, 16, 5, 734, 1971.
3. Дж. Най. Физические свойства кристаллов. Изд-во ин. лит., М., 1960.
4. Е. Н. Волкова, В. А. Дианова, А. Л. Зуева, А. Н. Израиленко, А. С. Липатов, В. Н. Парыгин, Л. Н. Ращкович, Л. Е. Чирков. Кристаллография, 16, 2, 346, 1971.
5. S. Hassühl. Acta crystallogr., A24, 6, 697, 1968.
6. О. Г. Влох, И. В. Кутний, В. Я. Нестеренко. Укр. физ. ж., 15, 2, 327, 1971.
7. Г. Ф. Добржанский, Л. А. Кулевский, Ю. Н. Поливанов, А. М. Прокоров, В. В. Смирнов. Сб. Краткие сообщения по физике, 8, Ротапринт Физ. ин-та АН СССР, 1970, стр. 61.

Львовский государственный
университет

Поступила в редакцию
12.VIII.1971
С доработки
16.XII.1971